



Sonderseminar des Zentrums für Materialforschung (ZfM/LaMa)

Dienstag, 25.02.2020

diverse Uhrzeiten nach vorheriger Anmeldung (je 1,5 h Dauer) – siehe unten
Seminarraum C 106, Seminar- und Hörsaalgebäude Chemie

Referent: Frank Krause
(Keyence Deutschland GmbH, Neu-Isenburg)

Die Laserscanning-Mikroskope der VK-X Baureihe von KEYENCE (Hands-on-Seminar)

Abstract: Es erwartet Sie eine Präsentation mit theoretischer Einführung in die moderne Laserscanning-Mikroskopie und einer ausführlichen Vorstellung der KEYENCE VK-X Baureihe. Dabei haben Sie die Möglichkeit, eigene Proben und Bauteile live mit dem Demo-Gerät in vielfältigen Mess- und Verarbeitungsmodi zu untersuchen:

- Profilmessungen mit vielen Messfunktionen
- Rauheitsmessung nach DIN EN ISO – Normen 4287 & 25178
- Auflösung: 2D-Messungen bis zu 120nm / Höhenmessung: 0,5nm
- Hochauflösende 3D-Laserscanning-Messverfahren in 16 Bit Technologie - mit 65536 Graustufen und DIN EN ISO normkonform
- Großflächen-Scans mittels Fokusvariation DIN EN ISO normkonform
- 3D-Datenexporte der Oberflächendaten per *.asc / *.stl oder *.stp Files.
- Ebenheitsmessungen
- 3D-Vergleich
- Partikelanalysen: Fläche, Volumen etc.
- Vollautomatische, anwenderunabhängige Analysen und Vergleiche von Oberflächenkennwerten

Feinste Strukturen lassen sich auflösen, auch solche, die häufig erst im REM sichtbar werden. Damit ist das System auch eine Brückentechnologie zwischen klassischer Lichtmikroskopie und REM. Bitte bringen Sie Ihre Proben / Bauteile mit zu dem Termin.

Das Seminar findet in Kleingruppen (bis zu 6 Personen) statt. Es werden drei unmittelbar aufeinanderfolgende Termine von 1,5 Stunden Dauer angeboten.

Bitte melden Sie sich bis 17.02.2020 über den DFN-Terminplaner an:

<https://terminplaner4.dfn.de/O3dkargYrEI5z55S>

Alle interessierten Wissenschaftler/innen der am ZfM/LaMa beteiligten Arbeitsgruppen sind herzlich eingeladen.

Kontakt:

Dr. Martin Güngerich

Tel. (Uni-intern): -33602

E-Mail: martin.guengerich@lama.uni-giessen.de